

混合集成电路-PIND测试-百检网

产品名称	混合集成电路-PIND测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

1 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.3 X射线检查

2 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.7 内部目检

3 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.10 剪切强度

4 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.2 外部目检

- 5 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.5 密封
- 6 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.9 扫描电子显微镜（SEM）检查
- 7 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.4 粒子碰撞噪声检测（PIND）
- 8 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 1102/2.8 键合强度
- 9 混合集成电路通用规范 GJB 2438B-2017 表C.9 密封前老练
- 10 混合集成电路通用规范 GJB 2438B-2017 表C.9 非破坏性键合拉力
- 11 混合集成电路通用规范 GJB 2438B-2017 表C.9 内部目检
- 12 混合集成电路通用规范 GJB 2438B-2017 表C.9 温度循环
- 13 混合集成电路通用规范 GJB 2438B-2017 表C.9 机械冲击
- 14 混合集成电路通用规范 GJB 2438B-2017 表C.9 恒定加速度
- 15 混合集成电路通用规范 GJB 2438B-2017 表C.9 PIND